

CURSO BÁSICO DE: METROLOGÍA

INFORMES (COSTOS): direccion.tecnologica@cio.mx



[f](#) [t](#) [@](#) [v](#) [WWW.CIO.MX](http://www.cio.mx)

CURSO - PRÁCTICO



OBJETIVOS

Al término del curso los participantes:

- Comprenderán las bases de la Metrología en general, así como la aplicación y ventajas en los servicios y procesos de producción.

METODOLOGÍA

El instructor proporcionará una base de conocimiento mediante exposiciones apoyadas en material visual; el participante interactuará respondiendo en las dinámicas de cada módulo.

DIRIGIDO A

- Personal relacionado con actividades de calibración, medición o pruebas y/o manejo de instrumentos de medición.
- Gerentes de calidad.
- Técnicos.
- Metrólogos.
- Jefes de laboratorios de calibración, pruebas y ensayos.
- Responsables del aseguramiento de la calidad.
- Auditores de sistemas de calidad.
- Así cómo público en general interesado en elevar la calidad de su empresa.

BENEFICIOS

- Contar con personal capacitado para la interpretación de resultados de calibración.
- Reducir procesos por la buena práctica del metrólogo en el control de calidad.
- Conservar los equipos de la empresa en un estado óptimo y tendrán mayor vida útil debido a los conocimientos metroológicos adquiridos en el curso.

CONTENIDO

MÓDULO 1

METROLOGÍA LEGAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Conocer la definición de metrología y su clasificación; la aplicación de la Metrología Legal en México.

- 1.1 Definición de Metrología.
- 1.2 Metrología legal.
- 1.3 Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
- 1.4 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
- 1.5 Dirección General de Normas.
- 1.6 entidad mexicana de acreditación (EMA).

MÓDULO 2

METROLOGÍA CIENTÍFICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

Conocer quienes generan la metrología científica en México.

- 2.1 Metrología Científica.
- 2.2 Centro Nacional de Metrología.
- 2.3 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
- 2.4 Instituto Nacional de Ecología.

MÓDULO 3

METROLOGÍA INDUSTRIAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Conocer la importancia de la metrología industrial en México.

- 3.1 Metrología industrial.
- 3.2 Sistema General de Unidades de Medida.
- 3.3 Vocabulario Metrológico.

INSTRUCTOR

- MIAC. Ana Isabel Vega Ramírez.



DURACIÓN

- El curso taller tiene una duración de 8 horas.

REQUISITOS DEL PARTICIPANTE

- Carrera técnica como mínimo. (deseable)

INCLUYE

- Notas.
- Diploma.
- Coffee Break y Comida (en caso de ser impartido en las instalaciones del CIO).

INFORMES E INSCRIPCIONES

direccion.tecnologica@cio.mx

M. en A. Mayte Pérez Hernández.

Tel. (477) 441 42 00 Ext. 157

Liga de inscripción:

<https://ares.cio.mx/CIO/cursos/fichaInscripcionCurso.php>

LUGAR

Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. Loma del Bosque 115, Col. Lomas del Campestre. C.P. 37150 León, Gto., México

NOTAS DE PAGO

El costo deberá ser cubierto en su totalidad al aceptar esta propuesta.

- El pago deberá efectuarse a NOMBRE: Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., en las instalaciones del CIO o mediante una transferencia bancaria en: BBVA BANCOMER, S.A. en a la CUENTA: 0443010023 CLABE: 01 222 500 443010023 9 SUC: 0714 PLAZA: LEÓN, GTO. Importante: enviar depósito a direccion.tecnologica@cio.mx (con sello bancario al frente)

